

## TJ & nanoIP 2017 PROGRAM Szklarska Poręba

Środa, 8.03.2017

16:00 Początek pracy Sekretariatu konferencji

17:00 Otwarcie TJ & nanoIP

Wspomnienie o śp. Pani Profesor Aleksandrze Sokołowskiej

17:10 FIB Workshop

- Introduction
- mgr. inż. Piotr Kunicki, mgr inż. Wojciech Majstrzyk - FIB/SEM technology in MEMS/NEMS modification and characterization
- New products and technologies (FEI)

19:00 Kolacja

Czwartek, 9.03.2017

8:00 Śniadanie

8:30 *Zajęcia w plenerze*

14:30 Obiad

15:20 Referaty – Sesja 1 *chairman:* prof. dr hab. Stanisław Mitura

15:20 – 15:50 prof. Ivo W. Rangelow

15:50 – 16:15 dr inż. Anna Sobczyk-Gudzenda - Struktura chemiczna i właściwości fotokatalityczne powłok dwutlenku tytanu z dodatkiem żelaza i miedzi nanoszonych metodą RF PECVD

16:15 – 16:40 dr Markus Kaestner - Mix & Match Field Emission Scanning Probe Lithography (FE-SPL) for beyond CMOS Device Fabrication

16:40 Przerwa kawa, herbata

17:00 Referaty – Sesja 1 cd. *chairman:* prof. dr hab. Jerzy Żuk

17:00 – 17:45 prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, Prof. dr hab. Bogdanowicz – Węglowe struktury sensoryczne – modyfikacja powierzchni materiałów węglowych dla potrzeb analityki i diagnostyki biochemicznej

17:45 – 18:10 prof. dr hab. Stanisław Mitura - Plazmowo modyfikowany nanodiament jako dodatek do elektroprzędzonych nanowłókien

18:10 – 18:35 dr inż. Michał Pośpiech – Istota przepływu jonów w biodegradacji kardio-implantów

18:35 – 19:00 mgr inż. Michał Marek Szczypiński – Wpływ defektów powierzchniowych drutu typu Kanthal na kształtowanie nanowarstwy Si osadzonej metodą PVD.

19:00 Uroczysta kolacja

Piątek, 10.03.2017

8:00 Śniadanie

9:00 Referaty – Sesja 2 *chairman:* prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek

9:00 – 9:30 prof. dr hab. Jerzy Żuk - Spektroskopia optyczna nanokrystalitów związków półprzewodnikowych A3-B5 utworzonych w SiO<sub>2</sub>/Si przy użyciu implantacji jonowej

9:30 – 9:55 dr inż. Mariusz Sochacki - Charakteryzacja elektryczna izotypowej oraz anizotropowej fotodiody heterozłączonej ZnO/4H-SiC

9:55 – 10:20 dr inż. Piotr Firek - Wytwarzanie i trawienie cienkich warstw dielektrycznych w technologii struktur ISFET

10:20 – 10:45 dr hab. inż. Andrzej Sikora - Wykorzystanie technik precyzyjnego pozycjonowania próbek w badaniach AFM degradacji powierzchni polistyrenu poddanego działaniu UV

10:45 – 11:10 mgr inż. Wojciech Kijaszek - Zastosowanie indukcyjnie sprzężonej plazmy wielkiej częstotliwości w procesie chemicznego osadzania warstw diamentopodobnych z fazy gazowej celem modyfikacji ich właściwości

11:00 Przerwa kawa, herbata

11:30 Szkolenie w zakresie nanoIP / I: Szkoła spektroskopii impedancyjnej *chairman:* prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

11:30 – 12:00 dr inż. Tomasz Piasecki – Introduction to the impedance spectroscopy

12:00 – 12:30 mgr inż. Paulina Szymanowska – Investigation of biochemical and biological structures using impedance spectroscopy.

12:30 – 13:00 mgr inż. Krzysztof Kwoka – Application of the impedance spectroscopy in vibrating micro- and nanostructures diagnostics.

13:00 Obiad

14:00 Szkolenie w zakresie nanoIP / II Szkoła pomiarów powierzchni SPM *chairman:* prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

14:00 – 14:30 mgr inż. Krzysztof Gajewski, mgr inż. Michał Babij – Zastosowanie mikroskopii STM/AFM w badaniach nanostruktur mechanicznych

14:30 – 15:00 mgr inż. Maciej Rudek – Pomiary termiczne w nanoskali za pomocą skaningowej mikroskopii termicznej

15:00 – 15:30 mgr inż. Michał Świątkowski – Współczesne kierunki rozwoju mikroskopii sił atomowych

15:30 – 16:00 dr inż. Grzegorz Józwiak – Rola i znaczenie reprezentacji obrazu w mikroskopii bliskich oddziaływań

16:00 Przerwa kawa, herbata

16:30 Sesja plakatowa

18:00 Kolacja

19:00 Prezentacja sprzętu, badanie próbek <sup>kawa, herbata</sup> Zamknięcie TJ & nanoIP 2017

Sobota, 11.03.2017

9:00 Śniadanie